

日本信頼性学会
第24回春季信頼性シンポジウムプログラム

日時：2016年5月23日（月）10：30～19：00
場所：一般財団法人日本科学技術連盟 東高円寺ビル

（敬称略）

	第1会場（2階講堂）	第2会場（3階A室）
10：30～12：00	第38回年次総会	—
12：00～13：00	昼食	昼食
13：00～13：30	新会長挨拶	—
13：30～15：00	特別講演 「VLSIテスト技術によるシステムディペンダビリティ向上への期待」 梶原 誠司氏（九州工業大学大学院） 司会 長塚 豪己（中央大学）	—
15：00～15：10	休憩	休憩
	セッション1 （システムの信頼性、保全性、ライフサイクルおよびソフトウェア面） 司会：石田 勉（元）日本アイ・ピー・エム(株)	セッション3 （安全性、リスク） 司会：高橋 聖（日本大学）
15：10～15：30	日本企業におけるライフサイクル コスティングへの取り組みの現状と課題 —東証一部上場企業アンケート調査結果からの考察— ○中島洋行（明星大学），Lcc研究会	踏切保全装置の安全性再評価に関する考察 ○志田 洋，大串裕郁（西日本旅客鉄道(株)），高橋 寛（愛媛大学大学院）
15：30～15：50	信頼性を定量的に測定する —信頼性設計の効率的評価法（1）— ○長谷部光雄（のっぽ技研），柴田義文（安信経営工学研究所）	高周波電位治療器による自律神経失調症の回復効果の検証 村岡哲也（第一工業大学），池田弘明（コンサルタント），原川清仁（(株)マルタカテクノ），○金 勇剣（第一工業大学）
15：50～16：10	仮想複数ストレス ー時間（MS-T）モデルと安定性設計 —信頼性設計の効率的評価法（2）— ○柴田義文（安信経営工学研究所），長谷部光雄（のっぽ技研）	Analyzing claim data to detect major quality problems for QCMM ○Meena Watcharathiansakul, Watalu Yamamoto, Kazuyuki Suzuki（University of Electro-Communications）
16：10～16：30	信頼性を定量的に測定する電子部品の寿命線図適用における留意点 —信頼性設計の効率的評価法（3）— ○松岡敏成（三菱電機(株)）	
16：30～16：40	休憩	休憩
	セッション2 （試験、故障解析、部品、要素技術の信頼性、ハードウェア面） 司会：土屋 英晴（アンデン(株)）	
16：40～17：00	リチウムイオン二次電池の劣化における充放電サイクル数と待機時間の影響 ○横川慎二（電気通信大学），長野祐児（職業能力開発総合大学校）	
17：00～17：20	薄膜SMDヒューズの断線故障メカニズムと対策 ○佐藤博之（(株)アドバンテスト）	—
17：20～17：40	高分解能斜めCTの最新技術 ○安達昭司（(株)ユニハイトシステム）	
17：40～18：00	積層セラミックコンデンサ故障箇所の非破壊特定技術 ○土屋英晴（アンデン(株)），井原惇行（楠本化成(株)）	
18：10～19：30	情報交換会	（会場：5階研修室）

*発表タイトルの変更は報文集にて訂正します。司会者は変更する場合があります。